

Sony Energy Devices Corporation

1-1 Shimosugishita, Takakura, Hiwada-machi, Koriyama-shi, Fukushima, 963-0531 Japan

Phone: +81-50-3807-3059 / Fax: +81-50-3807-3765

## リチウムイオン電池認証書 (類似機種用)

## Lithium-ion (polymer) rechargeable cell or battery Certification for Similar Models

No.: QA-C4085 Date: 2014/11/18

Page: 1 of 7

1. □単電池 / cell (□シングルセル / single cell □シングルセルバッテリー / single cell battery)

■組電池/battery(pack) (セル構成/composition of cell: 1P5S

2. 機種名/customer model name: BL1820B Sony model name: LIP5010

3. 顧客名/customer: Makita Corporation

4. 定格/rated

項目/item	規格值/specification	備考/remarks
公称電圧/nominal voltage	18 V	
定格容量/rated capacity	2000 mAh	
ワット時定格値(Wh)	36 Wh	
∕Watt·hour rating		

- 5. 類似機種及び試験結果/Similar Model and Test Result
  - 1)類似機種名/Similar Model (Sony model name): LIP5006 (18 V 2000 mAh 36 Wh)
  - 2) 試験結果/Test Result

国連勧告テスト結果/Test results of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods

国連	勧告テスト及び判定基準(38.3 リチウム電池)	テスト結果/	備考/remarks
NO	テスト項目 test item	test results	一個名/ remarks
T1	高度シミュレーション (Altitude simulation)	OK	
T2	温度試験 (Thermal test)	OK	
Т3	振動 (Vibration)	OK	
T4	衝撃(Shock)	OK	
T5	外部短絡(External short circuit)	OK	
T6	衝突(Impact)/圧壊(Crush)	OK	
T7	過充電 (Overcharge)	OK	単電池は対象外/for battery only
T8	強制放電(Forced discharge)	OK	

試験実施日/Tested Date: 2012/10/09~2012/11/09

(T6:2013/09/13, T8:2011/10/25~2011/11/01)

梱包試験実施日/Tested Date for Package: 2013/12/02~2013/12/04

上記テスト結果は国連勧告試験(UN Manual of Tests and Criteria 5<sup>th</sup> revised edition Amendment 1, Part Ⅲ, subsection 38.3)に従い確認した結果であることを証明いたします。

We, Sony Energy Devices Corporation, hereby certify that above results are confirmed in accordance with the Manual of Tests and Criteria of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 5<sup>th</sup> revised edition Amendment 1, Part III, subsection 38.3.

3)類似機種とのワット時定格値(Wh)、電圧比率/Ratios for Watt-hour rating, Voltage 類似機種に対して、ワット時定格値(Wh)の変化が20%以内、且つ電圧の増加が20%以内である ことを証明します。

We certify the change of the subject model to the similar model is in Watt-hour rating of less than 20% and the increase in voltage of less than 20%.

LIP5010/LIP5006: ワット時定格値 (Wh) 比/Watt-hour rating Ratio=100%、

電圧比/Voltage Ratio=100%

Koichi Miyota

Quality Assurance Department

Sony Energy Devices Corporation





Sony Energy Devices Corporation

1-1 Shimosugishita, Takakura, Hiwada-machi, Koriyama-shi, Fukushima, 963-0531 Japan Phone: +81-50-3807-3059 / Fax: +81-50-3807-3765

Page: 2 of 7

A: Checklist for Judging New Type Cell or not

When there is no change in all items, it is NOT considered to be a New Type Cell. (Change  $\Rightarrow \bigcirc$ , No change  $\Rightarrow -$ )

Battery Pack Model: LIP5010 Component Cell Model: US18650VTC4A

Dattery Lack Model . Dil	6010 Component Cen Model: CE10000 1 C 11	
Check item	The element which is given influence	Presence of change
components	Are the safety parts and mechanical components of this cell the same as those of the test completion cell?	-
Cathode material system	Is cathode material system of this cell the same as that of the test completion cell?	_
Anode material system	Is anode material system of this cell the same as that of the test completion cell?	_
Electrolyte material system	Is electrolyte material system of this cell the same as that of the test completion cell?	_
Judgment result	New Type or not	Not new



Sony Energy Devices Corporation

1-1 Shimosugishita, Takakura, Hiwada-machi, Koriyama-shi, Fukushima, 963-0531 Japan Phone: +81-50-3807-3059 / Fax: +81-50-3807-3765

Page: 3 of 7

#### B: Checklist for Judging New Type Battery or not

Confirmation of presence of change in "The element which is given influence" (Change  $\Rightarrow \bigcirc$ , No change  $\Rightarrow -$ )

When there is no change in all items, it is NOT considered to be a New Type Battery.

Battery Pack Model: LIP5010

Test Item (Function)	The element which is given influence	Presence of change
T1: Altitude Simulation (Decompression load)	<ul> <li>Crimped part, Gasket (Cell)</li> <li>Gas Release Vent, Cell Case (Cell)</li> <li>Pack (Plastic) Case</li> <li>Holding Member (Insulator, Insulation Tape, Both Sides Tape)</li> <li>Coating materials</li> </ul>	_
T2: Thermal Shock (Repetition of high temp. and low temp.)	<ul> <li>Crimped part, Gasket (Cell)</li> <li>Gas Release Vent, Cell Case (Cell)</li> <li>Finished state of Wound Electrodes (Cell)</li> <li>Pack (Plastic) Case</li> <li>Holding Member (Insulator, Insulation Tape, Both Sides Tape)</li> <li>Coating materials</li> </ul>	
T3 : Vibration (Vibration load)	<ul> <li>Finished state of Wound Electrodes (Cell)</li> <li>Electric wiring member</li> <li>Electronic Parts on a circuit board</li> <li>Cell Holding Member</li> <li>(Adhesive, Both Sides Tape, Lib of Plastic Case)</li> </ul>	-
T4 : Shock (Shock load)	<ul> <li>Wiring Member</li> <li>Electronic Parts on a circuit board</li> <li>Cell Holding Member</li> <li>(Adhesive, Both Sides Tape, Lib of Plastic Case)</li> <li>Finished state of Wound Electrodes (Cell)</li> </ul>	_
T5 : External Short Circuit (Short current)	<ul> <li>Over voltage Protection</li> <li>Current Control Device</li> <li>Safety Device of cell (Cell)</li> <li>Lead Tab</li> </ul>	-
T6(Cell) : Impact (Crash load)	<ul><li>Separator (Cell)</li><li>Insulation State in a cell (Cell)</li></ul>	
T7(Pack) : Overcharge (Charge load)	<ul><li>Overcharge Protection</li><li>Thermal Device</li><li>Safety Device of cell (Cell)</li></ul>	
T8(Cell) : Forced Discharge (Over discharge load)	• Finished state of Wound Electrodes (Cell)	_
Judgment result	New Type or not	Not new

# 国連勧告試験 結果 1

No:

QA-C4085

DATE:

2014/11/18

Test Result of UN Recommendations Part 1

PAGE: 4 of 7 Page

機種名/Sony Model Name	LIP5006			
使用セル/Cell Model Name	US18650VTC4		構成/Configuration	1P5S
試験場所/Test Company	ソニーエナジー・デバイス	株式会社 郡山事業所		
住所/ Address	〒963-0531 福島県郡山市日	和田町高倉下杉下1−1	電話/Tel	+81-24-958-3811
試験室/Test Room	安全性試験室/野外試験室	試験期間/Test Dates	Т6:	2012/10/09~2012/11/09 2013/09/13 2011/10/25~2011/11/01
判定基準/Criterion	UN Manual of Tests and subsection 38.3	Criteria 5th revised o	edition Amendme	nt 1, Part Ⅲ,

試験名	B称/Test Name	T1:	高度シミュレーシ	归ン試験	Altitude	Simulation		
番号 No.	サンプル状態 Conditions	試験前。 Mass(g)	Before OCV (V)	試験後 Mass(g)	∕After OCV (V)	質量減少率 / Mass Loss <%以下>	OCV維持率/ Residual OCV 〈90%以上〉	現象確認/ Occurrence
1	初回サイクル	370.3	20.47	370.3	20.45	0.00	99.9	N
2	満充電/	370.4	20.46	370.4	20.45	0.00	100.0	N
3	First cycle, fully	370.0	20.46	370.0	20.44	0.00	99.9	N
4	charged	370.5	20.47	370.5	20.44	0.00	99.9	N
5	50回サイクル	370.4	20.46	370.4	20.21	0.00	98.8	N
6	満充電/	370.1	20.48	370.1	20.46	0.00	99.9	N
7	After 50 cycles,	370.3	20.47	370.3	20.45	0.00	99.9	N
8	fully charged	370.3	20.48	370.3	20.46	0.00	99.9	N

試験名	呂称/Test Name		T2:温度試	験	Therma	1		
番号	サンプル状態	試験前。	∕Before	試験後	∕After	質量減少率	OCV維持率/	現象確認/
田与 No.	クラフルA: Conditions	Mass(g)	OCV (V)	Mass(g)	OCV (V)	/ Mass Loss <%以下>	Residual OCV 〈90%以上〉	Occurrence
1	初回サイクル	370.3	20.42	370.3	20.28	0.00	99.3	N
2	満充電/	370.4	20.42	370.4	20.28	0.00	99.3	N
3	First cycle, fully	370.0	20.40	370.0	20.25	0.00	99.3	N
4	charged	370.5	20.40	370.4	20.25	0.03	99.3	N
5	50回サイクル	370.4	19.40	370.4	18.29	0.00	94.3	N
6	満充電/	370.1	20.43	370.1	20.28	0.00	99.3	N
7	After 50 cycles,	370.3	20.42	370.3	20.28	0.00	99.3	N
8	fully charged	370.3	20.42	370.3	20.27	0.00	99.3	N

試験名称/Test Name		T3:振動試験 Vibration					W///2015	
番号 No.	サンプル状態 Conditions	試験前。 Mass(g)	Before OCV (V)	試験後 Mass(g)	∕After OCV (V)	質量減少率 / Mass Loss <%以下>	OCV維持率/ Residual OCV 〈90%以上〉	現象確認/ Occurrence
1	初回サイクル	370.3	20.28	370.3	20.27	0.00	100.0	N
2	満充電/	370.4	20.28	370.4	20.27	0.00	100.0	N
3	First cycle, fully	370.0	20.25	370.0	20.23	0.00	99.9	N
4	charged	370.4	20.25	370.4	20.24	0.00	100.0	N
5	50回サイクル	370.4	18.29	370.4	18.20	0.00	99.5	N
6	満充電/	370.1	20.28	370.1	20.27	0.00	100.0	N
7	After 50 cycles,	370.3	20.28	370.3	20.26	0.00	99.9	N
8	fully charged	370.3	20.27	370.3	20.26	0.00	100.0	N

質量減少率/ Mass Loss(%)	□ 電池質量 ≦ 1g: 0.5%以下 □ 1g < 電池質量 ≦ 75g: 0.2%以下 ■ 75g < 電池質量: 0.1%以下
	破断:R 〈Rupture〉 発火:F 〈Fire〉 破裂:D 〈Disassembly〉 弁作動:V 〈Venting〉 漏液:L 〈Leakage〉 異常なし:N 〈No rupture, No fire, No disassembly, No venting, No leakage〉

国連勧告試験 結果 2

No: QA-C4085

DATE:

2014/11/18

Test Result of UN Recommendations Part 2

PAGE: 5 of 7 Page

試験名称/Test Name			T4:衝擊試	験	Shock			
番号 サンプル状態		試験前。	/Before	試験後	試験後/After		OCV維持率/	現象確認/
图写 No.	Conditions	Mass(g)	OCV (V)	Mass(g)	OCV (V)	/ Mass Loss <%以下>	Residual OCV 〈90%以上〉	Occurrence
1	初回サイクル	370.3	20.27	370.3	20.27	0.00	100.0	N
2	満充電/	370.4	20.27	370.4	20.27	0.00	100.0	N
3	First cycle, fully	370.0	20.23	370.0	20.23	0.00	100.0	N
4	charged	370.4	20.24	370.4	20.23	0.00	100.0	N
5	50回サイクル	370.4	18.20	370.4	18.17	0.00	99.8	N
6	満充電/	370.1	20.27	370.1	20.26	0.00	100.0	N
7	After 50 cycles,	370.3	20.26	370.3	20.25	0.00	100.0	N
8	fully charged	370.3	20.26	370.3	20.26	0.00	100.0	N
-	質量減少率/ lass Loss(%)	□ 電池質量	≦ 1g: 0.5%以下	□ 1g < 電	池質量 ≦ 75g:	0.2%以下 ■	75g < 電池質量	: 0.1%以下
現象	東/Occurrence	破断:R <rup 漏液:L <lea< td=""><td>oture〉 発火 kage〉 異常な</td><td></td><td>波裂∶D 〈Disas pture, No fire,</td><td></td><td>作動:V <ven y, No venting,</ven </td><td></td></lea<></rup 	oture〉 発火 kage〉 異常な		波裂∶D 〈Disas pture, No fire,		作動:V <ven y, No venting,</ven 	

試験	呂称/Test Name	T5:外部	短絡試験		External Sho	ort Circuit	
番号 No.	サンプル状態 Conditions	最大表面温度 ∕Max. Surface Temperature (℃) 170℃≧	現象確認/ Occurrence	番号 No.	サンプル状態 Conditions	最大表面温度/Max. Surface Temperature (℃) 170℃≧	現象確認/ Occurrence
1	初回サイクル	69.0°C	N	5	50回サイクル	67.8°C	N
2	満充電/	69.5°C	N	6	満充電/	68.7°C	N
3	First cycle, fully	68.0°C	N	7	After 50 cycles, fully	69.3°C	N
4	charged	69.1°C	N	8	charged	69.0°C	N
現象		破断:R〈Rupture〉 発: 異常なし:N〈No rupture,			D <disassembly></disassembly>		

試験名称/Test Name		T6: <del>衝突 (Impact)</del> /圧壊	(Crush)
番号 No.	サンプル状態 Conditions	最大表面温度/Max. Surface Temperature (℃) 170℃≧	現象確認/Occurrence
1		25°C	N
2	初回サイクル	24°C	N
3	50%充電/	25°C	N
4	First cycle, 50% charged	24°C	N
5		23°C	N

試験名称/Test Name		T7:過充電 Overcharge				
番号 No.	サンプル状態 Conditions	現象確認/Occurrence 番号 No.		サンプル状態 Gonditions 現象確認/Occuri		
1	初回サイクル	N	5	50回サイクル	N	
2	満充電/	N	6	満充電/	N	
3	First cycle, fully	N	7	After 50 cycles, fully	N	
4	charged	N N	8	charged	N	
現象	≹/Occurrence	発火:F〈Fire〉 破裂:D〈Disassemb	oly〉 昪	≹常なし:N ⟨No fire, No	disassembly>	

## 国連勧告試験 結果 3

No: QA-C4085

DATE:

2014/11/18

Test Result of UN Recommendations Part 3

PAGE: 6 of 7 Page

試験名称/Test Name		T8:強制放電 Forced Discharge			ge	
番号 No.	サンプル状態 Conditions	現象確認/Occurrence	番号 No.	サンプル状態 Conditions	現象確認/Occurrence	
1		N	11		N	
2		N	12		N	
3		N	13		N	
4	初回サイクル	N	14	50回サイクル	N	
5	完全放電	N	15	完全放電	N	
6	/ First cycle,	N	16	/ After 50 cycles,	N	
7	fully discharged	N	17	fully discharged	N	
8		N	18		N	
9		N	19		N	
10		N	20		N	
現象	現象/Occurrence 破断:R〈Rupture〉 発火:F〈Fire〉 破裂:D〈Disassembly〉 異常なし:N〈No rupture, No fire, No disassembly〉					

#### 国連勧告試験 梱包結果

No: QA

QA-C4085

DATE:

2014/11/18

PAGE: 7 of 7 Page

Test Result of UN Recommendations for Package

試験場所/ Test Company	ソニーエナジー・デバイス 株式会社 郡山事業所							
住所 / Address	〒963-0531 福島県郡山市日和田町高倉下杉下1-1					+81-24-958-3811		811
試験室/ Test Room	オクト産業㈱評価室	試験期間/ Test Dates 2013/12/02~2013/12/04		試験番号 /Test No	LP-1311-02		02	
機種名/ Sony Model Name	LIP5006MKPD(	SY6)		梱包入り数 /Quantity			10 p	cs
使用セル/ Cell Model Name	US18650VTC4C	構成/ Configuration		1P5S	梱包製造 Package		ZDL	
包装等級 / Packing Group	等級Ⅱ/Packing Grou	p Number II			<del></del>		2.	
寸法・質量 /	長辺/Length(L)	短辺 /Wide	(W)	高さ/Heigh	t (H)	質量 /	Gross Weig	ht (kg)
Dimensions and Gross Weight	420 mm	160	mm	140	mm		5	kg

落下試験/Drop Test						
試験設備	DT-100B					
試験条件/ Test_condition	落下高さ /Drop height	1. 2m	試験結	果 /Occurrence		
落下姿勢(方向) / Five (one for each	1回目の落下試験	底面を水平に/ flat on the bottom		damage liable to affect		
drop)	2回目の落下試験	天面を水平に / flat on the top	著しい破損なし No Leakage, No	/ o damage liable to affect		
2nd 4th	3回目の落下試験	長側面を水平に/ flat on the long side	著しい破損なし No Leakage, No	/ o damage liable to affect		
W L	4回目の落下試験	短側面を水平に/ flat on the short side	著しい破損なし No Leakage, No	/ o damage liable to affect		
5th 1st	5回目の落下試験	コーナー(角)※/ on a corner	著しい破損なし No Leakage, No	/ o damage liable to affect		
TSC	※コーナー: 容器が最も破損を受ける方向を選択					
判定基準/ Criterion		合、外装容器の最も外側の層 かすようないかなる破損が生	判定/ Judgment	合格/OK		

積み重ね試験/Stacking Test						
試験条件/Test condition			No	試験結果 /Occurrence		
3mの想定段数算出/ Equivalent package number stacked up 3m			1 1	漏洩・破損・歪みなし/ No leakage, No distortion, No		
試験荷重値算出/ Examination load calculation value 105 kg			2	漏洩・破損・歪みなし/  No leakage, No distortion, No		
試験荷重値/Weight Load 105 kg				漏洩・破損・歪みなし/  No leakage, No distortion, No		
判定基準/ Criterion	試供品は漏洩があってはならない。試供品は、輸送の安全性を損なうような劣化、又はその強度を減じたり、又は輸送物の積重ねを不安定にするような 歪みが生じてはならない。		判定/ Judgment	合格/OK		

Koichi Miyota

Quality Assurance Department

Sony Energy Devices Corporation

総合判定

合格/OK